

工业测控系统的抗干扰技术



作者：葛长虹编著

出版社：北京：冶金工业出版社

出版日期：2006.04

总页数：237

介绍：本书分别介绍了干扰的产生、干扰波的传播、工业测控系统的电磁干扰抑制、单片机测控系统的抗干扰技术、微机测控系统的抗干扰技术、工业测控系统抗干扰应用等内容。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11600641.html>）查找全本阅读方式

工业测控系统的抗干扰技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11600641.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11600641.html>

书名：工业测控系统的抗干扰技术